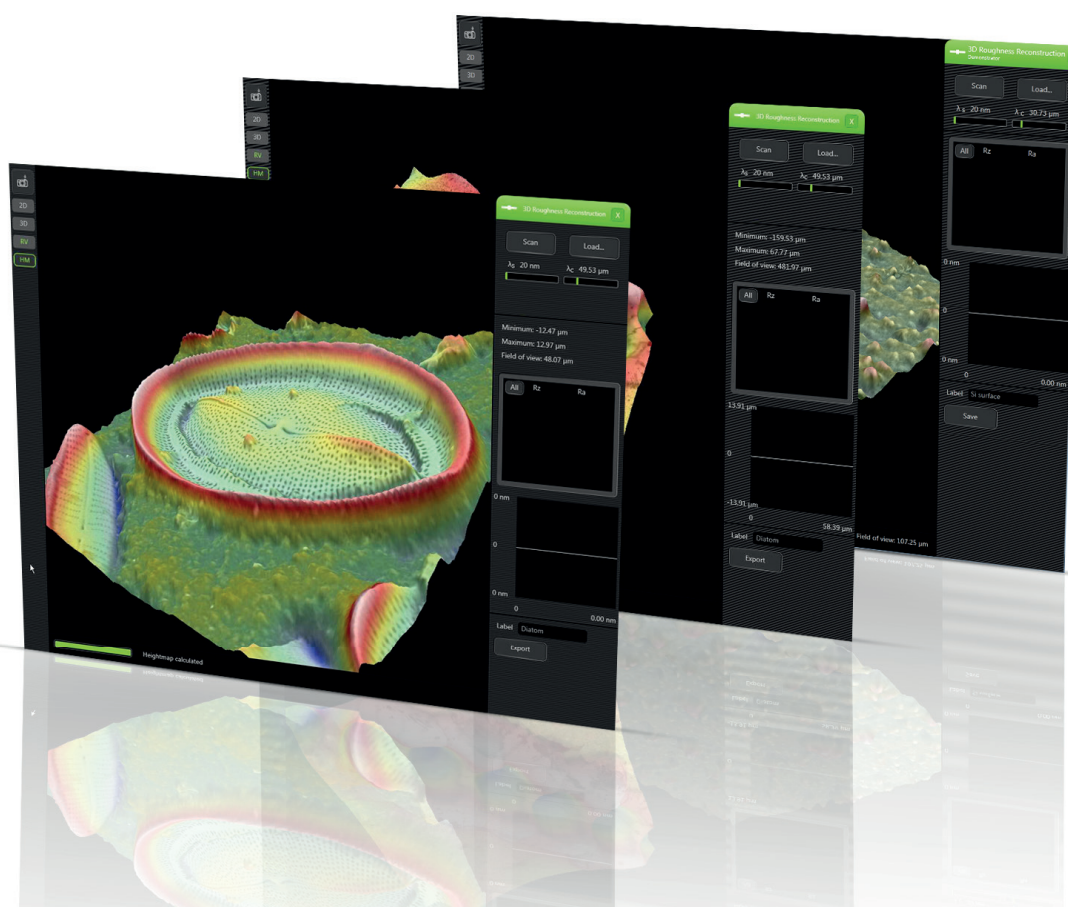


3D粗糙度重建系统

展现样品特征

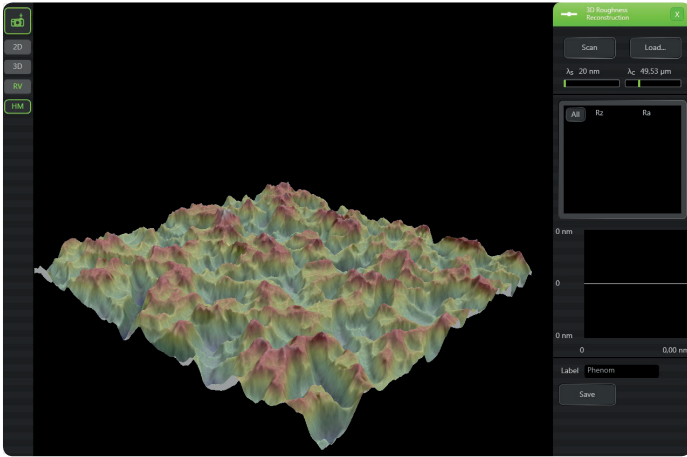


优于光学或机械测量系统

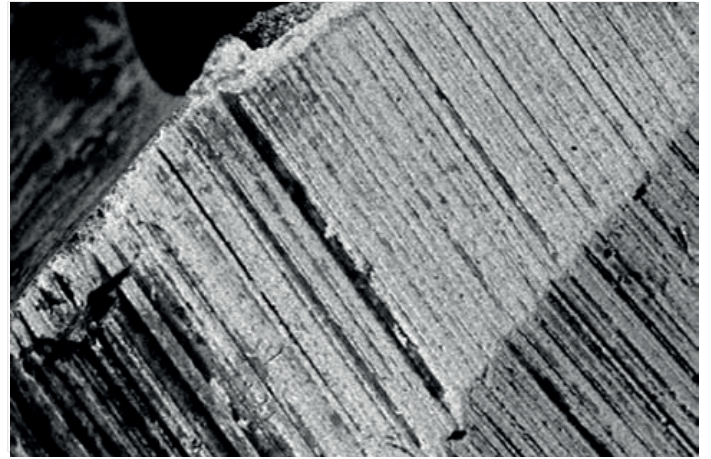
基于“阴影显形”，无需倾斜样品

一键3D重建

操作界面直观



粗糙材料表面粗糙度重建图像，图中不同颜色代表不同高度



钻头顶视图，放大倍数 2900x

借助 3D 粗糙度重建系统，飞纳台式扫描电镜 (SEM) 可以生成样品的三维图像，并进行亚微米量级的粗糙度测量。基于“阴影显形”技术，3D 成像有助于展示样品特征。

3D

3D 图像可以帮助用户更好地理解样品特点，使得在 2D 图像中很难分辨的凹坑、划痕、刻纹等特征，变得清晰可见。

粗糙度

平均粗糙度 (Ra) 及粗糙高度 (Rz) 的测量对于生产工艺的控制和改进具有重要意义。使用 SEM 图像作为信息收集手段，可以获得比传统 (非直接) 手段更佳的分辨率。

3D 粗糙度重建模块是飞纳台式扫描电镜的理想扩展，特别适用于下列领域：

- 机械加工的质量控制
- 纹理分析
- 证物鉴定
- 缺陷 & 失效分析
- 摩擦学-磨损分析

3D 粗糙度重建系统可在包含多个飞纳台式扫描电镜 (SEM) 特定应用程序的 Phenom ProSuite 中获得。

3D 粗糙度重建系统的主要优点：

- 远优于光学或机械测量手段
 - 高分辨率
 - 可测量反光样品
 - 直接测量
 - 非破坏性
- 创新性全自动用户界面
- 基于“阴影显形”，无需倾斜样品
- 完整解决方案
- 快速重建
- 直观的用户界面

规格参数

自动实时创建 3D 图像

- 全 3D 图像
- 2D 或 3D 图像
- 通过颜色指示高度过滤后的 3D 图像
- 基于“阴影显形”的技术，无需样品倾斜
- 快速重建

自动粗糙度测量

- Ra (平均粗糙度) 和 Rz (粗糙高度)
- 用户自定义滤波参数
- 支持 5 线同时测量

位置识别 分辨率

2 mm ~ 10 μm
1024 x 1024

输出

- 高度曲线
- CSV 信息
- 2D/3D 图像
- Word 格式

